RIBBON TARGET ASSEMBLY USING CARBON GRAPHITE FOR SECONDARY EMISSION TYPE BEAM PROFILE MONITOR

Satoru Otsu ^{#,A)}, Yoshinori Hashimoto^{B)}, Takeshi Toyama^{B)}, Suguru Muto^{B)}, Minoru Mitani^{C)} ^{A)} Mitsubishi Electric System & Service Co., Ltd, 2-8-8 Umezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0045, Japan ^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK), 1-1 Oho, Tsukuba Ibaraki, 305-0801 ^{C)} Minotos Engineering, 1-16-28 Naka, Kunitachi, Tokyo, 186-0004

Abstract

We developed a secondary emission type beam profile monitor with graphite ribbons as a beam target. The graphite is excellent in endurance against heat load, and that they are thin as 1.6-2.0 micron and low z (=6) is advantage for reducing beam loss. Furthermore, since ribbons emits larger amount of electrons than ordinal metal wires because of larger surface, the monitor has higher sensitivity. On the other hands, in case of multi-ribbon type, uniformity of secondary electron emission is required for accurate measurement. For the uniform emission, not only surface homogeneity, but also evenness for each ribbon width is needed. A suitable manufacturing method to make ribbon target from graphite-foil, and emission uniformity has been studied.

カーボングラファイトを用いた二次電子放出型ビームプロファイルモニター のためのリボン状ターゲットアッセンブリ

1. はじめに

大強度陽子加速器 J-PARC Main Ring(MR)のビームトランスポートで使用している MRPM (Multi Ribbon Beam Profile Monitor)^[1]では、グラファイトリ ボンからの2次電子を用いて、ビーム強度1.5e13 ppb のプロファイルをクリアに計測している^[2].また通 常のワイヤータイプに比べてリボンの表面積が大き いので、大強度ビームのビームコアだけでなく、 ビームテールもクリアに計測することができる^[2]. このようなマルチリボンを用いた測定においては、 各リボンにおける2次電子放出率の一様性が要求さ れる.そのためにはグラファイト表面状態の一様性

だけでなく、リボン幅も一定にする必要がある.特 にグラファイトシートのたわみは、一様なリボンに レーザーカットする際のエラーとなるために、100 µm 以下に小さくする必要がある.

今回の報告では、特に均一な電子エミッション確保のためのリボンターゲット製作のための基本的な試験:(1)ターゲットのたわみを減じるためのテンションをかけた貼り方とレーザーカットした時のリボン幅の相関、(2)2次電子放出率のエミッションの



図1: グラファイトの構造. 配向によりベンゼン環 が面内に整然と並ぶ. 2µm厚みのものの断層写真



図2:1.6µm厚みのグラファイト

計測,(3) リボンの引っ張り破断試験についてを中 心に、また新規に2µm厚みのグラファイトフォイル ^[4,5]の製作R&Dを進めており、その進展状況も合せ て報告する.また、2011年3月の東日本大震災での 震度6の罹災であり、8台の既設の実機のターゲット の被害が心配されたが皆無であった.

2. グラファイト

実機に使用した厚み1.2~2.0 µmのグラファイト フォイル(GF)は、本ターゲット用に特別に大型化 (サイズ:300mm^L max,180mm^W max) して製作さ れたものである^[3].図1に、SEMによる断面写真を 示す.グラファイトは、結晶子が大きく靱性を持つ (図2).また、焼成温度は2600~3000℃であり耐熱 性が高い.

また、グラファイト(z = 6) は、質量密度が2.0 [g/cm³]と小さいため、薄いことと相まってビームロ スが小さい^[2]. ターゲットの温度上昇は、ビームサ イズに依るが、ANSYSでの計算から最大200[°]Cと予 想されている^[2]. 実機への使用においては高い耐久 性が要求されるため、2つの試験を行った(図3).

[#] z-sohtsu@post.j-parc.jp

ーつはロングラン試験である(a). KEK-NMLの シャットダウンまでの11か月連続して、500 MeVの 陽子ビーム(強度2e12 ppb, サイズ45^H×15^V mm²)を 20 Hz で総粒子数 5e20 を照射し健在であった.ま た,東工大バンデグラフにおいて、3.2 MeVのNe⁺ ビーム(DC, 3.0 μ A, 8 mm ϕ)を照射した(b). 放射温 度計(精度±100℃)で計測したターゲットフォイ ルの温度は1400℃であった.67分間にわたり健在で あった.このような試験を通してビームロスでの発 熱に対しての高い耐久性を確認した.



図3: (a) 5e12 p の照射後,フォイルにはニュートン リングのようなカラーパターンが付いた.厚みの減 少を示している.(b)1400℃でのビーム照射時.

3. ターゲットの製作に関するいくつかの 基本的な試験

各リボンにおいて均一な2次電子のエミッション を得るには、たわみを小さくし、リボンの幅が揃っ ていることがポイントである.フォイルをフレーム に貼り付けるときにたわみが発生するとレーザー カット時に、レーザーの光学焦点位置に対するズレ が生じ、ビームウェストではなく、レーザービーム が広がった位置でカットすることになるからである.



図4: フレームへのフォイルアプライ過程(試験用 ターゲット:内寸100×100 mm²:読出電極無し,仮 貼り用ターゲット:内寸186×198 mm²)

3.1 フレームへのフォイルアプライ方法

薄くて固いグラファイトフォイルはハンドリングが 難しく,たわみを残さない貼り方について試行錯誤 してきたが,実機のターゲットに採用した方法の, 貼り付けの過程(図4)と,フォイルにテンション をかける方法(図5)を示す.実機7台では,この方 法によりたわみの少ないターゲットを作成している が十分な定量化がなされていなかった.そこで,作 成方法の確認やたわみ量などの基本的な測定と試験 を行うことにした.



図4では、まず(a)ターゲットより少し大きめの仮 貼り枠(内寸186 mm, ターゲットフレームに対して 片側28 mm広い)にフォイルをウレタン系の接着剤で 固定しておき、その内側にターゲットフレームを配 置する.このとき、仮貼り枠は印加するテンション に合わせて例えば3mm程度高くなるようにスペーサ を入れる.(b)ターゲット表面の読み出し電極には、 耐放射線性の導電性接着剤^[7]を10μm 厚み程度にス クリーン印刷しておき、その直後の3分程度(接着 剤の表面が乾かない)の時間内に、仮貼りフォイル (枠) とガラス板を乗せる. ガラス板のエッジには, Rをつけ、滑りのよい樹脂テープ(アセテート)を 貼り付けておく.(c)ガラス板の上に,1 kg程度の ウェイトを乗せる.(d)このとき,仮貼り枠から ターゲットフレームの段差(この場合は3mm)により, フォイルにテンションをかけた状態で接着剤の固化 (12hr程度)を待つ. 導電性接着剤と読み出し電極 間は5µm 程度に圧着させる必要があるためにフォ イル面の法線方向からの荷重と、フォイルのたわみ を減じ平坦性を確保するためにフォイル面の接線方 向への張力を同時に印可させる(図5)ことがポイ ントである.

3.2 3.1 の方法でのたわみ除去効果の測定

仮貼り時におけるたわみ深さとたわみ長の測定を 実体顕微鏡(×60)のピント合致位置を用いて測定し た(図6).たわみ深さは、鉛直方向のたわみの深 さをたわみがないとした場合の理想平面からの距離 で示し、たわみ長さは両側の固定端の内側にある フォイルの長さとして定義する.実機のターゲット フレームは、350×350 mm²のような大きなサイズで あるため、ストローク(250 mm^H, 80 mm^Z)の大きな ユニバーサルスタンドに実体顕微鏡とCCDカメラが マウントされている.図のA,Bでは、ターゲットリ ボンの位置と深度を測定するための目盛刻み10µm のダイアルゲージを付けた. 焦点深度が浅いため, リボンなどのエッジにピントを合わせる場合のAに よる測定位置の再現性は50回の統計で標準偏差が8 µmであり,これをたわみ深さの測定誤差とした. また,カメラの解像度は,60倍の倍率のとき,0.9 µmであり十分に高い. また,撮像画面内のリボン幅 の測定精度は,ピント合わせの再現性を含めて,50 回の統計において 2 µmであった. これをリボン幅 測定の誤差とした.





図7: 仮貼り時(実線)と荷重後(破線)のたわみの比較

ターゲットリボン幅 5 mmのテストターゲットを 作成して,たわみを測定することにより貼り付け時 の荷重の効果を調べた.仮貼り枠に入れたスペーサ が1,2,4 mmの場合の比較を図7に示す.最大1200 µmあったたわみ深さは、レーザーカットの焦点範 囲から要求される100 µm以下に収まる.また、平均 1500 µm 程度あったたわみ長さは、平均380 µmまで 小さくなった.短縮できるたわみ長さは、仮貼り時 のたわみに依存すると考えられる.今回は、仮貼り 時のリボンへの張力は特に与えていないため、仮貼 り時のたわみ長さのばらつきが大きくなっている. このばらつきを小さくすることで画一したテンショ ンの与え方が決まるはずである.今後は、後述の R&Dしているフォイルについて、詳細な試験を行う 予定である.

3.3 引っ張り試験

グラファイトはその構造から伸びの無い材料である.また適度なフレキシビリティーはあるものの, 硬く,特に配向面の法線方向からの刺激には脆い. フォイル貼り付け時の印可できるテンションの限界 を知るために,配向方向について荷重による引張り 試験を15回行った(図8).その結果,10mm幅のリ ボンでは,39gwで破断するものがあった.平均は 59.6gwであり,配向方向の強度は比較的高いことが わかった.



図8: グラファイトフォイルの引っ張り試験

4. R&Dフォイルのレーザーカットとビーム 照射試験

4.1 フォイル

ビーム照射試験用ターゲットの製作及び試験には, a:2ミクロンフォイル(R&D),b:現行2ミクロン フォイル,c:5ミクロンフォイル(R&D)の3種類 を用いた.aでは、テンションにより面上のシワや クラックなどが破断することがあったため200ミク ロン程度の局部的な垂み(変形)が生じた.これは, (イ)高配向性のため結晶子(図1)と称するグラ ファイト片がかなり大きく硬すぎること,(ロ)焼成 時の問題で凹凸及び小さなシワやクラックが発生し ていること(図9),が原因であり現在改善中である. b,cのフォイルでは、指でしわを伸ばす程度のテ ンションをかけただけで、ターゲットの製作を行っ た.

4.2 レーザーカット

試験用ターゲットのサイズは、 $34^{H} x 42^{v} mm^{2}$ (inside)であり、リボンは1 mm幅で2 mmピッチに YAGレーザ(波長1096 nm)で切断した. レーザー ビームの加工ステージ上の位置精度は10 µm であっ た. 切断部のエッジを滑らかにするため、複数回の スイープにより漸く切断できる程度までレーザーパ ワー密度を十分に落とし、レーザー衝撃を避けたが、 カットのエッジ部には小さなギザギザが残った(図 10). これは、テンションをかけない貼り付け方で あったため、各フォイルにたわみが残り、レーザー カット時の衝撃でフォイルが振動してしまったため であると、いままでの経験から推察している.



図9: aタイプの表面.凹凸や小さなクラックがみられる.



図10: a タイプのカットの線幅は端部では34 µm程 度, 垂み部分では50 µm程度になった.



図11: 試験用ターゲット. ビームを横切るように ターゲットをスイープする.

ビーム試験には、放射線医学総合研究所のエネル ギー6MeV/nのO⁸⁺を用いた.ビーム形状が安定と仮 定し、ビーム断面に対して図11のターゲットを空間 的にスイープさせ、各リボンでの二次電子放出量を エレクトロメータ(Keithley6517A)で計測した.0.5 mm ステップで、各点10パルスの積分した電子量を

得,同時刻のファラデーカップでのO⁸⁺電荷量で規 格化した.図12に、各測定点で得られた規格化した 2次電子量をプロットすることにより,得られたO⁸⁺ のビームプロファイルを示す. ビームプロファイル は、一次関数+ガウシアンでフィットし、標準偏差 σで評価した.一次関数は、特に図12 で左右不均 ーなテールを持つために付加したが,この測定時に 使用したエレクトロメータ用スキャナーのオフセッ トが原因であった. このためフィッティングはピー クの5%程度以下のテール部は、カットしておこ なった.結果を表1に示す.MRPM実機ではσのバ ラつきは1%以下が条件である. 実機使用2 μm^t のb タイプは、1.4%、5 μm^t のcタイプは、1.1%であっ た. 今後の実機に用いる予定のa タイプは, テン ションがかけられず3.0 %と悪かった. これはリボ ン幅が一定でないことに起因していると考えられる. 尚, すでにインストールした実機のターゲット製作 時にも同様の試験を行っているが、テンションをか けることで、 σ のばらつきは、0.2%以内に収めるこ とができた^[2].



図12: テンションなしのa, b, cタイプそれぞれ3本 によるビームプロファイルの計測結果

表1: ガウスフィット	、によるσ	とそのバ	ぶうつき
-------------	-------	------	------

Туре	σ(Avg.:mm)	(Dev.)
а	1.7985	3.00 %
b	1.8255	1.40%
с	1.8075	1.10%





この実験結果から推測されるテンションがかけら れないために、たわみが発生する問題を調べた.3. の測定方法により.ビーム試験用ターゲット(図11) のたわみとリボン幅の相関を調べた結果を図13に示 す.特にばらつきの大きいaタイプのリボンの測定 結果であるが、最大700 µm程度のたわみがあり、こ れにより1mmを基本幅とするリボンは、20µm 程度 減少してしまうことが明らかになった.これはたわ み位置では、レーザーカットが、ビームウェストよ りも下方のビームが広がっている位置での切断にな るためである.

5. まとめ

均一なリボンの製作に向けて、テンションをかけ る方法やビーム試験を通しての品質向上に向けた基 本スタディーを行った.開発中の2ミクロンのグラ ファイトリボンからの2次電子放出量のバラつきは、 3.0 %程度だった.面の不平坦性によりはりつけ時 にテンションがかけられなかったために、レーザー カットの線幅が一定にならない問題である.グラ ファイトには適度な結晶子の大きさを持たせ、靭性 と同時に柔軟性を持たせることがポイントである.

今回,たわみとレーザーカット後のリボン幅の関係などを明らかにした.また,たわみやリボン幅の自分たちの測定系を用意することができた.今後は,新しいR&Dフォイルを実機に使用するために,仮貼り時のテンションのかけ方を一定にする方法を完成させ,安定したターゲットの製作に結びつけたい.

尚,現実機のフォイルに宇部興産・大矢修生氏, 接着剤には、シチズン電子・赤尾祐司氏、レーザー カットには、弘陽精工・中澤繁雄氏、松本義明氏、 セラミックフレームには、有明マテリアル・岩永鉄 平氏、フォイルR&Dには、カネカ・西川泰司氏、稲 田 敬氏にお世話になった.ビーム試験では、放射 線医学総合研究所のHIMAC並びに中エネルギー照 射コースのみなさまにお世話になった.東工大での ビーム耐久試験は、KEK・菅井 勲氏、武田康弘氏 に行っていただいた.

参考文献

- [1] 特許出願公開番号 特開2007-101367 (查定済).
- [2] Y. Hashimoto, et al., "Multi-Ribbon Profile Monitor using Carbon Grafite Foil for J-PARC", Proceedings of HB2010, Morschach, Switzerland, 2010, P.429-433.
- [3] 特許出願公開番号 特開2002-308611.(宇部興産)
- [4] 西川泰司(カネカ),月刊ディスプレイ,2009年6月号
- [5] 西川泰司(カネカ), JETI, Vol.57, No.7(2009)
- [6] J. Kusano, Ed., "Collection of Radiation Irradiation Study Reports for the Candidate Materials and Instruments in the J-PARC", JAEA-Review 2008-022, 2008, P.24.